次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応してそれぞれ掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

改正後	改正前
第１　食品 Ａ　食品一般の成分規格 １～４　（略） ５　（略） ⑴・⑵　（略） ⑶　２，４，５－Ｔ試験法 １．装置 液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。 ２．試薬・試液 次に示すもの以外は、第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。 アセトニトリル　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 アセトン　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 エーテル　ジエチルエーテル。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（1,000mg）　内径12～13㎜のポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル1,000mgを充塡したもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。 グラファイトカーボン／エチレンジアミン－Ｎ－プロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム（500mg／500mg）　内径約12～13㎜のポリエチレン製のカラム管に、上層にグラファイトカーボンを、下層にエチレンジアミン－Ｎ－プロピルシリル化シリカゲル各500mg充塡したもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。 酢酸エチル　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 トルエン　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 ｎ－ヘキサン　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 水　蒸留水、精製水、純水等の化学分析に適したものを用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には、ｎ－ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。 無水硫酸ナトリウム　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。 メタノール　当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。	第１　食品 Ａ　食品一般の成分規格 １～４　（略） ５　（略） ⑴・⑵　（略） ⑶　２，４，５－Ｔ試験法 １．装置 電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。 ２．試薬・試液 次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。なお，「(特級)」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。 アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ－ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ－ヘキサン以外のピークの高さは，2×10^{-11}ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。 アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ－ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ－ヘキサン以外のピークの高さは，2×10^{-11}ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。 エーテル　エチルエーテル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，エチルエーテルを除去する。この残留物をｎ－ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ－ヘキサン以外のピークの高さは，2×10^{-11}ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。 塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ－ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。 カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μm）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。 ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。